

Title (en)
Microscope

Title (de)
Mikroskop

Title (fr)
Microscope

Publication
EP 1484627 A1 20041208 (DE)

Application
EP 04013269 A 20040604

Priority
DE 10325575 A 20030605

Abstract (en)
Microscope (100), especially a stereomicroscope, for simultaneous observation of an object by a first and a second viewer comprises a main objective (2) and deviating elements for deviating an observation beam path running parallel to the optical axis (2a) of the main objective into a first plane (I) extending at an angle to the optical axis and then into a second plane (II) extending parallel to and above the first plane. A separating device (7) separates an observation beam path of the second viewer from the observation beam path of the first viewer. A deviating device (20) deviates the observation beam path of the second viewer into a third plane (III) extending parallel to the first and second planes. The second plane lies between the first and the third planes.

Abstract (de)
Mikroskop, insbesondere Stereomikroskop, zur Simultanbeobachtung eines Objektes durch einen ersten und einen zweiten Beobachter, mit einem eine optische Achse (2a) aufweisenden Hauptobjektiv (2) und Umlenkelementen (5, 6, 7) zum Umlenken eines parallel zu der optischen Achse (2a) des Hauptobjektivs (2) verlaufenden Beobachtungsstrahlenganges in eine erste Ebene I, welche sich unter einem Winkel, insbesondere im wesentlichen senkrecht, zu der optischen Achse (2a) des Objektivs (2) erstreckt und anschließend in eine zweite Ebene II, welche sich im wesentlichen parallel zu der ersten Ebene I oberhalb von dieser erstreckt, und einer Auskopplungseinrichtung (7) zur Auskopplung eines Beobachtungsstrahlenganges des zweiten Beobachters von dem Beobachtungsstrahlengang des ersten Beobachters, wobei eine Umlenkeinrichtung (20) zur Umlenkung des Beobachtungsstrahlenganges des zweiten Beobachters in eine dritte Ebene III, welche sich im wesentlichen parallel zu der ersten und der zweiten Ebene I, II erstreckt, und die zweite Ebene II zwischen der ersten Ebene I und der dritten Ebene III liegt. <IMAGE>

IPC 1-7
G02B 21/18; **G02B 21/22**

IPC 8 full level
A61B 90/20 (2016.01); **G02B 21/18** (2006.01); **G02B 21/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)
G02B 21/18 (2013.01 - EP US); **G02B 21/22** (2013.01 - EP US); **A61B 90/20** (2016.02 - EP US)

Citation (search report)
• [PX] EP 1424581 A2 20040602 - LEICA MICROSYSTEMS SCHWEIZ AG [CH]
• [DXY] US 2001010592 A1 20010802 - NAKAMURA KATSUSHIGE [JP]
• [XY] EP 0398118 A2 19901122 - WECK & CO INC EDWARD [US]
• [X] EP 0464236 A1 19920108 - STORZ INSTR CO [US]

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)
EP 1484627 A1 20041208; DE 10325575 A1 20050113; DE 10325575 B4 20060413; JP 2004361962 A 20041224; JP 4542377 B2 20100915; US 2005018281 A1 20050127; US 7057807 B2 20060606

DOCDB simple family (application)
EP 04013269 A 20040604; DE 10325575 A 20030605; JP 2004168158 A 20040607; US 86051704 A 20040603